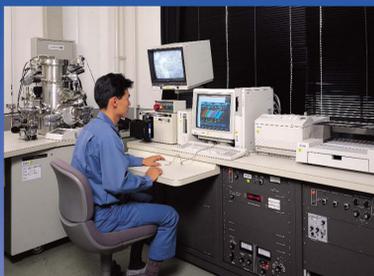


次世代の夢に向けて 信頼ある分析でお付き合いします。



オージェ電子分光分析 (AES)



オージェ分光分析装置

Element 元素・分離分析

ppbオーダーから主成分までの
定性・定量分析

- 薄膜の組成及び不純物分析
- 腐食生成物の定性、定量
- 半導体材料中の不純物分析
- 鉄鋼、非鉄金属、セラミック等の主成分及び微量成分の定量
- 半田の組成分析
- フラックス中のハロゲン、アルカリ成分の定量
- メッキ液、エッチング液の各種イオンの定量
- Siウエハの汚染物分析
- 油中ハロゲン及び有機酸 (イオン) の定量
- 樹脂中の不純物分析
- 高分子材料の分子量分布の測定
- 有機材料中のC,H,Nの定量



多機能表面分析装置

低加速走査電子顕微鏡



Composition

組成・構造解析

有機物の化学構造及び
無機物の結晶構造の解析

- ラミネートフィルムの層構造の解析
- 金属表面の防食被膜、防錆剤等の被膜の解析
- 樹脂、ゴム、接着剤、塗料等の有機化合物の同定
- 有機化合物中の添加剤の同定
- 液晶配向膜上の微小異物の解析
- 薄膜の結晶配向解析
- 結晶方位、結晶子サイズの解析
- 格子定数の精密測定
- 無機化合物の同定

分析業務内容

最先端テクノロジーが、
ここに結集。

Surface

表面・局所分析

深さ数+Å ~ 数μmの
表面・局所分析

- 半導体プロセスの微小異物の同定
- 金属材料等の微小領域の定量
- 多層薄膜の層構造と界面状態の解析
- Siウエハ中の不純物の深さ方向濃度分布解析
- 表面付着物、析出物の二次元分布状態の解析
- 金属表面酸化物、化合物の化学結合状態分析
- 有機物の表面改質層の評価
- 電子材料のマイグレーションの解析
- 腐食生成物の分布状態の解析
- 表面酸化膜等の薄膜の膜厚測定

Shape

形態観察

数十倍から百万倍までの
顕微鏡観察

- 半導体デバイスにおける微小部の形状観察
- 多層薄膜断面の層構造観察
- 粉体、焼結体等の粒子形状、粒径等の観察
- メッキ膜の膜厚測定
- Si及び化合物半導体の結晶構造解析
- 結晶粒径の測定
- 破面観察による破損原因の解析
- 金属、セラミック等の結晶欠陥の解析



二次イオン質量分析装置



X線マイクロアナライザー